

プログラムテストに用いるパスジェネレータへの 一考察

柳沢 隆夫
艾浦 工大

本論文は、プログラムの自動的なテストパス作成に於いて生じる、2つの問題のためのアルゴリズムを考慮している。

これらの問題は、有向グラフの全ての辺を含む最少のパス集合を決定することと、有向グラフの指定された辺の集合を通る最少のパス集合を決定することである。

A study of the Path Generator for Program Testing

Takao Yanagisawa
Shibaura Institute of Technology
Oomiya-shi, Saitama-ken, Japan

In this paper we consider algorithm for two problems that arise in automatic test path generation for program: the problem of determining a minimal set of paths which contain all the edges of a directed graph and the problem of determining a minimal set of paths which is through a specified edges of a directed graph.

1. はじめに

プログラムテストのための有向サイクルを含まない有向グラフの各々の辺を含む最少数パス集合を求める研究は、Debbi^[1]によって、割当アルゴリズムを用いてグラフをチェーンに分割し、輸送アルゴリズムによって、チェーンをパス集合に拡張して行われた。その後Natta^[2]によって、最少数経路法を用いて求められている。

一、有向サイクルが含まれていることを許したグラフに対する最少数パス集合の導出についての研究も、これまで若干行われている。(Page^[3]は正則式を用いて導出したが、この手法は簡潔で、計算時間が少なくて解けるが、プログラムが構造化されていないと適用出来ない)。

柳沢は先に、有向サイクルの有無に拘らず、グラフの指定された頂点とパスを通る最少数パス集合を求める方法(有向グラフの各節を含む最少数パス集合に帰着させて解く)を報告した。しかし、ここでは有向サイクルのコンデンスと強連結成分内のサブパスの導出に、D. F. S法(De p t h - F i n s t S e a c h)が用いられている。

本研究は、前回に於ける有向サイクルのコンデンスや、コンデンスされたものを元に戻す手続きが省略されるばかりに効率的であることも、最短のパス集合を求めるとさらに有効性が増すという問題を、前回とは異つて接近を試み、各有向辺を含み、最少数かつ最短のパス集合を求める解法を行った。

この解法は、最少数かつ最短のパス集合を導出する問題と、ネットワーク理論による最少数コストフローのS-T単位順枝列フロー分解とが等価であることを示し、続いて、大きなグラフの最少数コストフローの導出とS-T単位順枝列フローへの分解に、簡単で効率的な

アルゴリズムが応用出来ることを示すことにより行われる。

ところで、プログラムテスト法として、先ずプログラムグラフのテストパスを決定し、次にこれを通る入カデータを算出して行うものは、テストパスが不実行パスであったときは破局となる。もし、プログラムテストパスがプログラムのグラフをカバーの最少数のものであったときは、この問題は重大となる。この問題に対し、Kunduは、全てのグラフをカバーするテスト法として、未だテストされていないパスをプレディケート(predicate, そのパスを実行するメカ変数の満足すべき範囲)より、次のテストデータを決定し、この方法を全てのプログラムグラフがカバーされるまで続けるものを提案したが、この方法も、S-Tパス集合が大きいときは難解なものとなる。

本研究はテスト法として、先ずプログラムのスタートとデイリジョンの直ぐ後にカウンタを挿入し、いくつかの入カデータをランダムに入力してテストを行い、次の残りの未だ未テストの部分にテストを振り向けるテスト法の問題を扱う。

この問題は、プログラムグラフの指定された辺を通るパス集合を求めるものと等価である。本研究は、未テスト辺を含む最少数かつ最短のテストパスをグラフ理論を応用して導出するときに生じた種々の問題を検討した。

2. 本研究で使用される主な用語

有向グラフ G : 空でない集合 V と V と素な集合 E と、写像 $\phi: (E \rightarrow V \times V)$ で構成され、 V の元を G の頂点、 E の元を有向辺という。 $G = (V, E, \phi)$ で表す。

ネットワーク \mathcal{N} : 有向グラフ G と区間重み関数 l と活動 f (フロー) とが

ら構成される。 G は節点集合 V と付向枝集合 E より構成される。 I は枝集合上で定義され、 f の上, 下限を与えることなる閉区間 $I(e)$ を与える。 f は枝集合上で定義され、フロー守恒

$$\sum_{e \in W^+(x)} f(e) = \sum_{e \in W^-(x)} f(e) \quad (\forall x \in V)$$

を満足する。ここで、 $W^+(x)$ は節点 x より出る枝集合、 $W^-(x)$ は節点 x へ入る枝集合を示す。 $\mathcal{F} = [G, I, f]$ で表れる。

許容フロー：各枝を流れるフローが、枝の閉区間に入っているフロー。
 フローコスト：単位当りの枝流量を維持するのに必要なコスト率が、各枝に定数重み $r(e)$ として与えられているとするのフロー f の総コスト

$$\left(\sum_{e \in E} r(e) \cdot |f(e)| \right)$$

隣接する：有向グラフ G において、 $e_m = (v_i, v_j)$ $v_i, v_j \in V$ なる e_m が存在するならば、 v_i は v_j に隣接しているという。

到達する \leq ： G において、全ての $i = 1, 2, 3, \dots, m-1$ に対して、 v_i が v_{i+1} に隣接している頂点の連続 v_1, v_2, \dots, v_m が存在するならば、 v_1 は v_m に到達可能という。

パス J (順枝列)：各節が次の節に隣接している節の連続(各付向枝の始節が次の付向枝の終節になるような付向枝の連続。並列枝の無いネットワークでは、節の連続で表わして差しつかえない)

有向サイクル L (順閉路)：始めと終りの節点が一の順道。

単位順枝列フロー f_J ：順枝列に含まれる付向枝では $f(e) = 1$, それ以外では $f(e) = 0$

フローマトリックス F ：
 $f_{ij} = \begin{cases} f(e_m) & v_i \text{が} v_j \text{に隣接して} \\ & \text{且、} e_m = (v_i, v_j) \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$

強連結成分：どの $v_i, v_j \in V$ に対しても $v_i \leq v_j, v_j \leq v_i$ かつ、 G の極大な部分グラフ

3. 最少で最短なS-Tパス集合の導出

この節は、有向グラフ G の全ての有向辺を含む最少で最短なS-Tパスを導出する方法を述べる。

この方法は、グラフの各辺にフローの下限として1, コスト率として1を与え、そしてこのグラフの最少コストフローを構成し、そしてそれから、フローマトリックスを単位順道フローと単位順閉路フローに分解、結合して、最少で最短なS-Tパスを求める。

次に上記の方法で最少で最短なS-Tパスが求められることを述べる。

- (1). 任意の最少フローは、S-T単位順枝列フローに分解出来る。
- (2). 最少フローのS-T単位順枝列フロー分解に対応するS-Tパス集合は、 G の全ての有向辺を含む最少のS-Tパス集合である。
- (3). 最少コストフローのS-T単位順枝列フロー分解に対応するS-Tパス集合は G の全ての有向辺を含む最少で最短のS-Tパス集合である。

3.1. 最少コストフローの構成

1. 許容フローを構成する。
2. SよりTへ最少フローを流す。
3. 最少コストフローをフローマトリックスに構成する。

3.2. フローマトリックスよりパス集合の導出

フローマトリックスから、最少で最短なS-Tパス集合の導出は次のように行う。

上記により導出された最少コストフローマトリックスに因り、1の手続をE

行う。

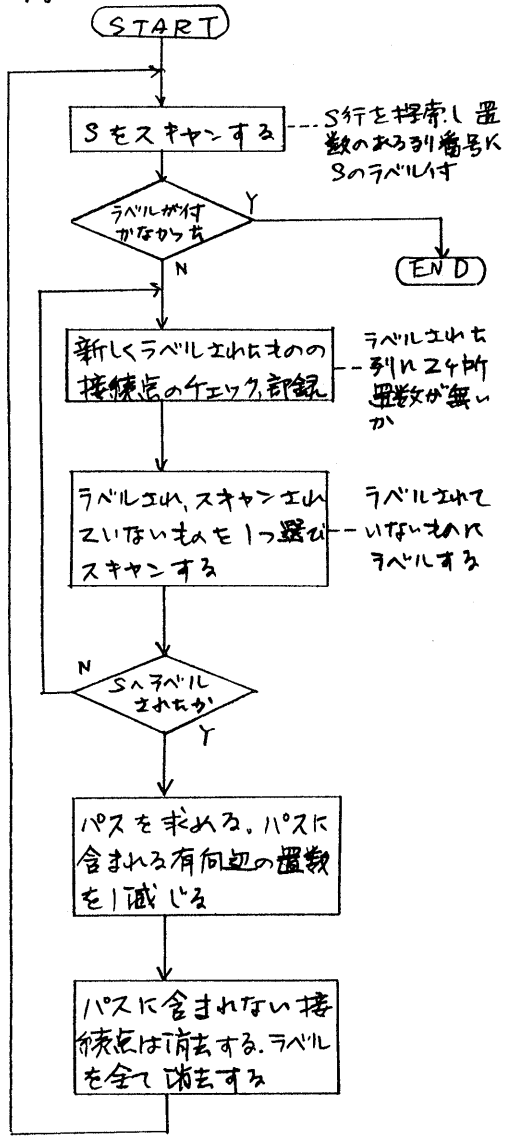


図. 1

図. 1の手続きの終了時点で、未だ出入フローのある全ての接続点をSとし行と列をかえて、図. 1の手続きを同様に行う。

上記の手続きが終了した時点で未だ出入フローのある接続点があったら、さらに同様に上記手続きを行う。

この5の手続きを繰返し、接続点が全くない段階で終了する。

図. 2は最少数コストフローが構成されたネットワークの例を表わしている。付向枝に付けられた値は、フロー値を表わしている。S-Tパス集合の導出は、1段階で例えば、(1 2 3 5 11 12 14 15)、(1 2 3 5 12 13 14 15)のパスが導出される。接続点は2つの有向枝が入っている節のため、この場合はA点となる。2段階で、(2 8 7 6 4 3)が導出され、逆向に変換されて、上記の11の逆の向きに接続される。例えば、(1 2 3 4 6 7 8 2 3 5 11 12 14 15)というパスが構成される。接続点はBとなる。3段階で、(1 2 3 4 6 7 9 10 6 7 8 2 3 5 11 12 14 15)(1 2 3 5 12 13 14 15)の最小のS-Tパスが得られる。

4. 未テスト辺を含む最小で最短なS-Tパス集合の導出。

4.1. 有向サイクルを含まないプログラムグラフの場合。
有向サイクルが含まれないグラフの最短な未テスト辺を含む最小パス集合の導出法について述べる。

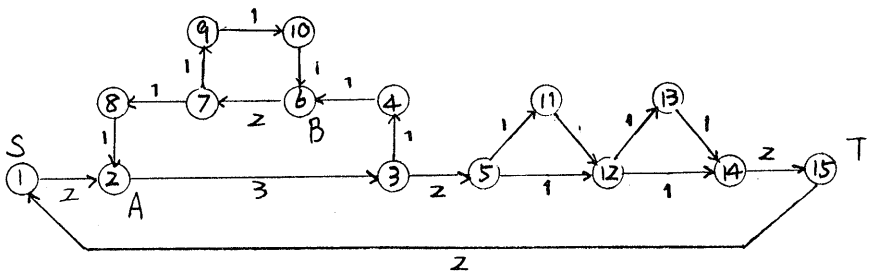


図. 2

この方法は、図. 3 のようにして導出する。

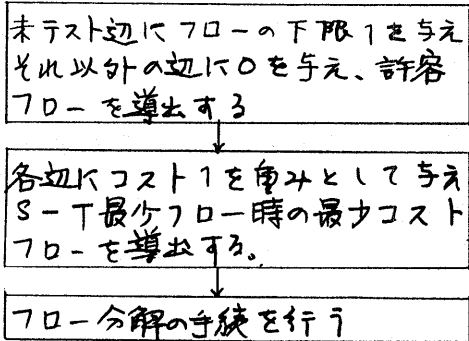


図. 3

図. 4 の例題でこの導出法を述べると、

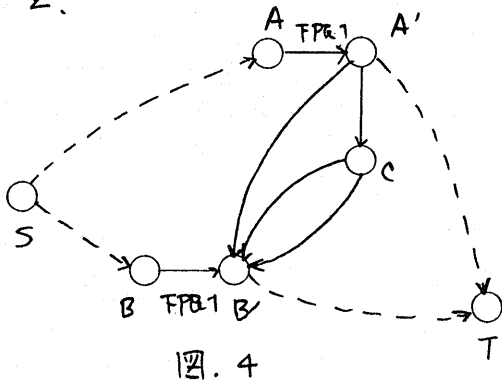


図. 4

例えば、許容フローは点線のように求まり、最少フローは T から S へ流せるだけ流すことにより求まり、最少コストフローはコスト率が負の閉路へのフロー重畳により求められる。

4.2. 有向サイクルを含むのを許したプログラムグラフの場合

有向サイクルを許したグラフの最短な未テスト辺を含む最少パス集合の導出法について述べる。

先に示した最少コストフローによる方法を直接適用すると、図. 5 のように、例えば許容フローは図となり、最少フロー導出 (2本の T から S へのフ

ローを流す) によりフローは 0 となることが生じる場合があり、目的のパスを導出することは出来ない。

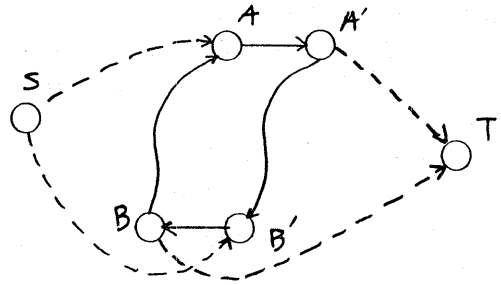


図. 5

このため、図. 6 のように、

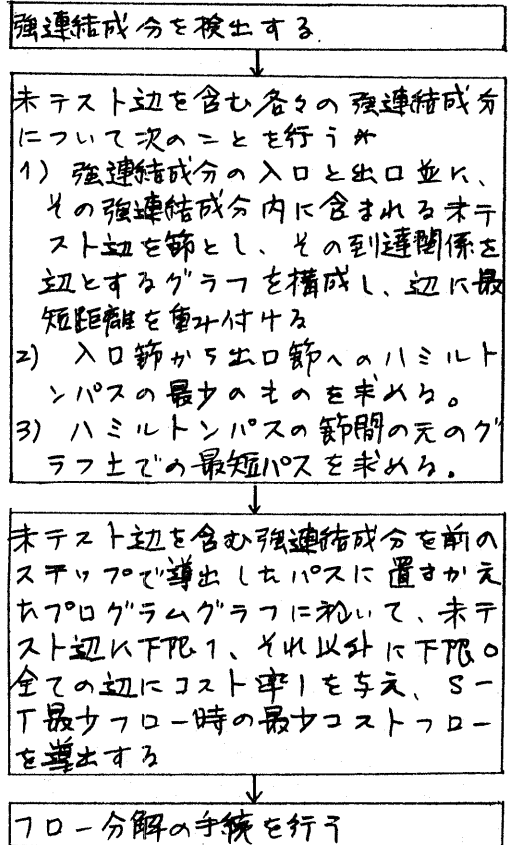


図. 6

ハミルトンパスの最短のものを導出するアルゴリズムを応用して解くことが

考えられる。

ところでこの方法は、ハミルトンパスの最短なものを求めるアルゴリズムを含んでおり、強連結成分内の未テスト辺の数が多きとき(例えば、10以上)は余り効率の良い方法は見いだされていない。

又、プログラムが構造化されていないとき、入口と出口の組合せの対により、未テスト辺を含む最短パスの長さが異なるため(図. 7)。

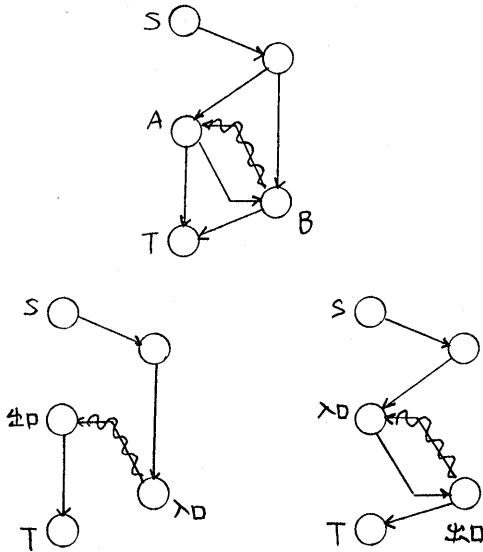


図. 7

入口と出口の組合せに対して、*の手続を行う必要がある。

しかし、この方法は未テスト辺は本来数が少ないことを考慮すると、実行上は有用な方法と思われる。

ところで、もし、強連結成分内に未テスト辺が直列に連続的に生じている場合は、この方法の*の部分を図. 8に変えることにより、ハミルトンパスを求めずに簡単に求める方法が考えられる。

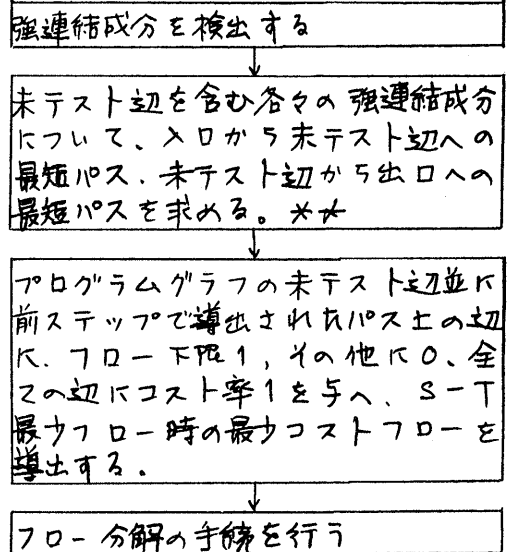
強連結成分内の未テスト辺の連続性の4エックは、強連結成分の検出の際に未テスト辺を記憶し、グラフの隣接

行列を用いて調べることにより、4エックが可能となる。このため、このテスト法の適用は、いくつかのテストの過程で、上記の条件が満足されたところで適用すればよいことになる。

未テスト辺を含む各々の強連結成分について、入口から未テスト辺の連続の尾の辺へ、未テスト辺の連続の頭の辺から出口への最短経路を求める

図. 8

ハミルトンパスの最短なものを求めるのは、一般には難解であることと、テストパスは必ずしも最短であることは要求しないことを考慮して、次に有向サイクルを含むのを許したグラフの未テスト辺を含む最少パス集合を効率的に求める方法を述べる。この方法のA案とB案は、次のようになる。



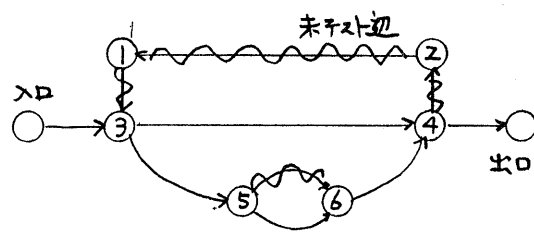
A案

図. 10

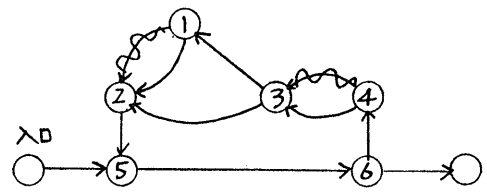
上記A案の、**の部分を変え
るとB案となる。

未テスト辺を含む各々の強連結成分
について、入口から未テスト辺を順
々に近いものから近いものへと進み
出口まで辿るパスを求める

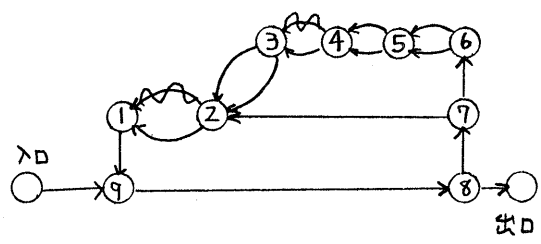
A案とB案の最短路を得る可能性の
大・小については、未だ検討しなけれ
ばならないが、A案の導出法はB案ま
り、ラベリング法を用いて効率よく行
うことが出来る。



A, B案可



B案可



A, B案共不可

図. 11

5. 参考文献

- [1]. R. K. Deb, On Generation of Test Data and Minimal Cover of Directed Graph, IFIP Congress Proceedings, pp13-16, 1977.
- [2]. S. C. Ntafos and S. Louis Hakimi, On Path Cover Problems in Digraphs and Applications to Program Testing IEEE Transaction On Software Engineering, Vol. SE-5 No 5, pp 520-529, 1979.
- [3]. 柳沢隆夫, プログラムテストに用いるパスジェネレータへのグラフ理論の応用(オ1報), 芝浦工大研究報告理工系編, オ30巻, オ1号, 1986.
- [4]. R. E. Prather, Theory of Program Testing - An Overview, THE BELL SYSTEM TECHNICAL JOURNAL, Vol. 62, No. 10, part 2, pp. 3073-3105, 1983.
- [5]. 柳沢隆夫, パスカバ-法によるプログラムテストデータの自動生成法に關して, 芝浦工大研究報告理工系編, 30巻, オ2号, 1986.